

RAPPORT  
TECHNIQUE  
TECHNICAL  
REPORT

CEI  
IEC  
831-2

1988

AMENDEMENT 2  
AMENDMENT 2

1993-07

---

---

Amendement 2

**Condensateurs shunt de puissance auto-régénérateurs destinés à être installés sur des réseaux à courant alternatif de tension assignée inférieure ou égale à 660 V**

**Deuxième partie:**

Essais de vieillissement, d'auto-régénération et de destruction

Amendment 2

**Shunt power capacitors of the self-healing type for a.c. systems having a rated voltage up to and including 660 V**

**Part 2:**

Ageing test, self-healing test and destruction test

© CEI 1993 Droits de reproduction réservés — Copyright — all rights reserved

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale 3, rue de Varembé Genève, Suisse

---

---



Commission Electrotechnique Internationale  
International Electrotechnical Commission  
Международная Электротехническая Комиссия

---

---

AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le comité d'études 33 de la CEI: Condensateurs de puissance.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

DIS	Rapport de vote
33(BC)103	33(BC)105

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cet amendement.

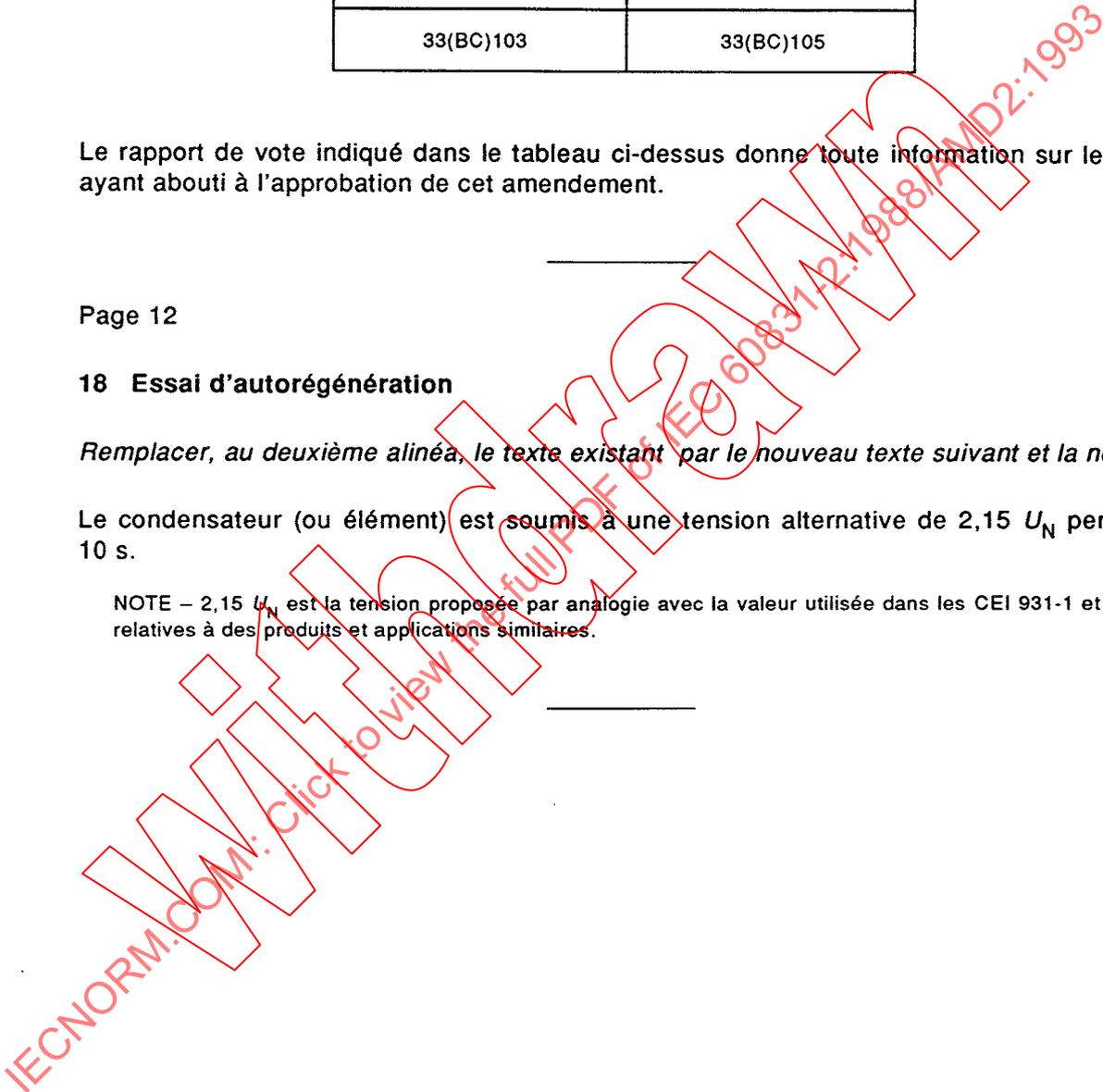
Page 12

**18 Essai d'autorégénération**

*Remplacer, au deuxième alinéa, le texte existant par le nouveau texte suivant et la note:*

Le condensateur (ou élément) est soumis à une tension alternative de  $2,15 U_N$  pendant 10 s.

NOTE –  $2,15 U_N$  est la tension proposée par analogie avec la valeur utilisée dans les CEI 931-1 et 871-1 relatives à des produits et applications similaires.



## FOREWORD

This amendment has been prepared by IEC technical committee 33: Power capacitors.

The text of this amendment is based on the following documents:

DIS	Report on voting
33(CO)103	33(CO)105

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report on voting indicated in the above table.

---

Page 13

### 18 Self-healing test

*Replace, in the second paragraph, the existing text by the following new text and the note:*

The capacitor or element shall be subjected for 10 s to an a.c. voltage of  $2,15 U_N$ .

NOTE –  $2,15 U_N$  is proposed considering the same value is in use in IEC 931-1 and IEC 871-1 for similar products and applications.

---

IECNORM.COM: Click to view the full PDF of IEC 60831-2:1988/AMD2:1993